コヒーレント遷移放射を用いた 超短パルス電子ビームの観測



阪大産研

○野澤一太、菅晃一、楊金峰、小方厚、 近藤孝文、法澤公寛、小林仁、吉田陽一

2013年1月10·11日 第10回高輝度高周波電子銃研究会 @SPring-8

- ✓ 背景 超短パルス電子ビーム パルスラジオリシス法
- ✓ 超短パルス電子ビーム発生法 レーザーフォトカソードRF電子銃ライナック 磁気パルス圧縮器 短パルス化のための改善点
- ✓ コヒーレント遷移放射によるパルス幅測定法 コヒーレント遷移放射 光学系・測定法の概要
- ✓ 超短パルス電子ビームパルス幅測定結果
- ✓ 結論と展望

- ✓ 背景 パルスラジオリシス法 超短パルス電子ビーム
- ✓ 超短パルス電子ビーム発生法 レーザーフォトカソードRF電子銃ライナック 磁気パルス圧縮器 短パルス化のための改善点
- ✓ コヒーレント遷移放射によるパルス幅測定法 コヒーレント遷移放射 光学系・測定法の概要
- ✓ 超短パルス電子ビームパルス幅測定結果
- ✓ 結論と展望

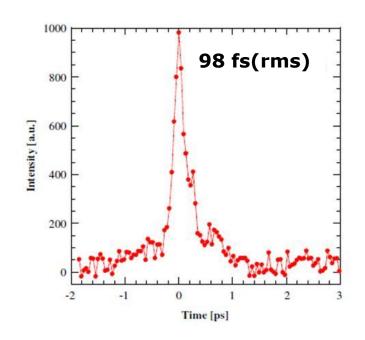
背景

なぜ超短パルス電子ビームが必要なのか?

放射線化学初期過程を解明するため 応用分野:原子炉化学、がん治療、 半導体リソグラフィー

→パルスラジオリシス法では、化学 反応の時定数より短い電子ビームが 必要となる。

現状の最短パルスは100fs



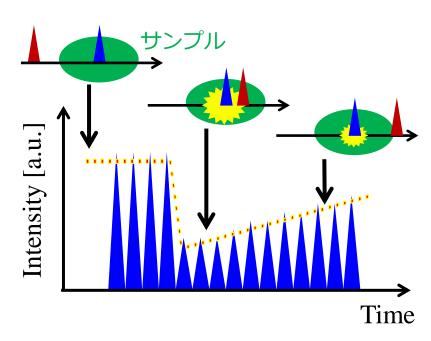
最先端超短パルス 電子ビーム

背景

パルスラジオリシス法

- 放射線化学反応の時定数 より短い放射線パルスを 照射
- ・ サンプルを励起・イオン 化し、短寿命中間活性種 を生成
- 時間分解計測手法により、 その挙動を直接的に観測

電子ビーム レーザー パルス パルス



ストロボスコピック法

背景

パルスラジオリシス法の時間分解能 g

$$g \cong \sqrt{\delta t_{e-beam}^2 + \delta t_{laser}^2 + \delta t_{jitter}^2} + (n-1)\frac{L}{c}$$

 δt_{e-beam} :電子ビームパルス幅

 δt_{laser} : レーザーパルス幅

 δt_{iitter} : RF同期時間ジッター

L: サンプル長

g: 時間分解能

時間分解能の向上には全て のパラメータを低減する必 要がある。

パルスラジオリシス法の時間分解能向上のために、アト秒・ フェムト秒の超短パルス電子ビーム発生が必要となる。

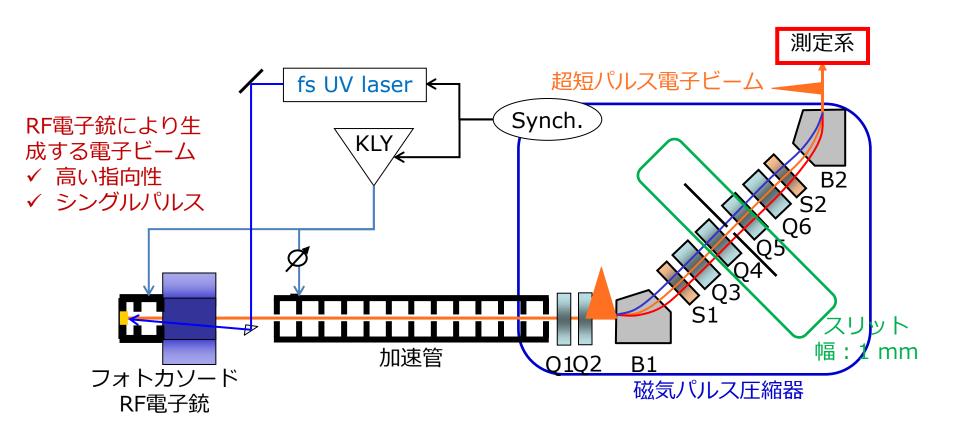
研究目的

アト秒パルスラジオリシス実現のための アト秒電子ビームの発生と計測

- フェムト秒RF電子銃・高次収差補正用磁気パルス圧縮器・スリットの導入により、アト秒電子ビームを発生する。
- 従来よりも高時間分解能を有する新しい超短パルス電子 ビームのパルス幅計測法の開発を行う。

- ✓ 背景 パルスラジオリシス法 超短パルス電子ビーム
- ✓ 超短パルス電子ビーム発生法 レーザーフォトカソードRF電子銃ライナック 磁気パルス圧縮器 短パルス化のための改善点
- ✓ コヒーレント遷移放射によるパルス幅測定法 コヒーレント遷移放射 光学系・測定法の概要
- ✓ 超短パルス電子ビームパルス幅測定結果
- ✓ 結論と展望

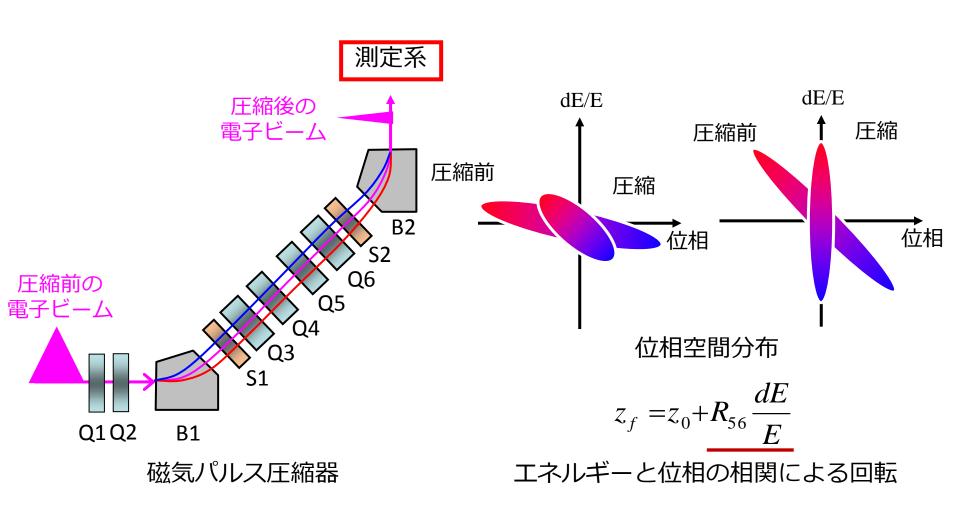
レーザーフォトカソードRF電子銃ライナックを用いた 超短パルス電子ビーム発生法



超短パルス電子ビーム発生のための改善点

- ●フェムト秒レーザーフォトカソードRF電子銃
- ●高次収差補正用磁気パルス圧縮器
- ●スリットの導入

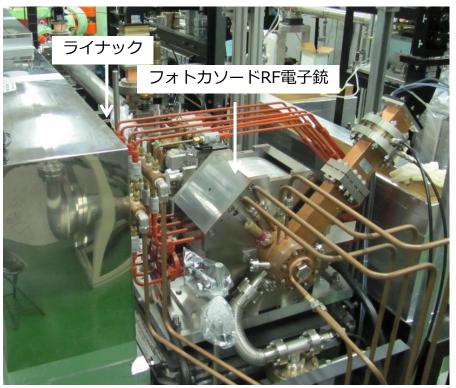
磁気パルス圧縮器



(一定電荷量時の)加速管加速位相によるパルス幅の変化

フェムト秒レーザーフォトカソードRF電子銃





Ti:Sapphire fs laser

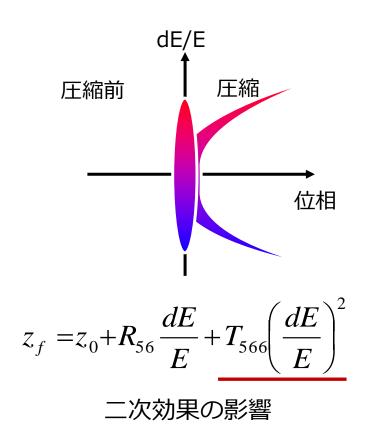
フォトカソードRF電子銃

フォトカソードRF電子銃を用いて、従来よりも 短パルスの電子ビームを発生

高次収差補正用磁気パルス圧縮器

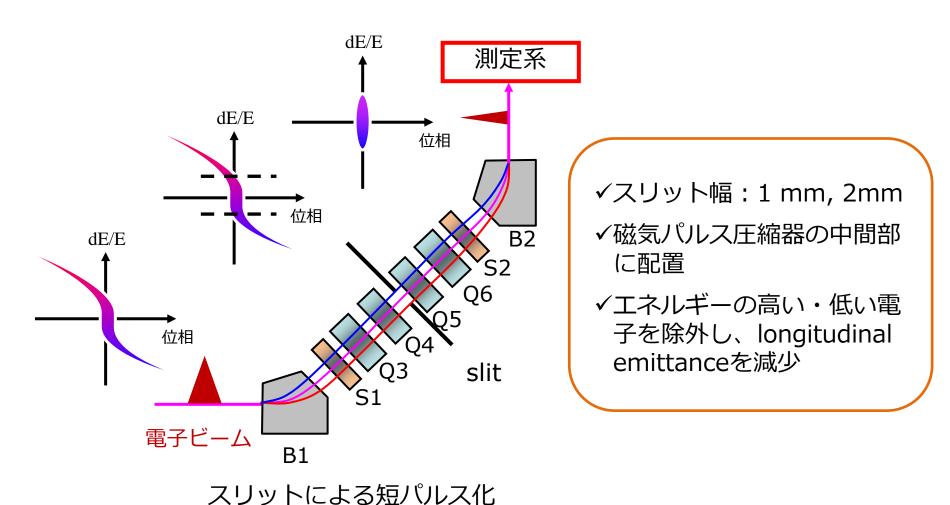


磁気パルス圧縮器



六極電磁石で2次効果を補正

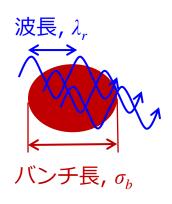
スリットの導入



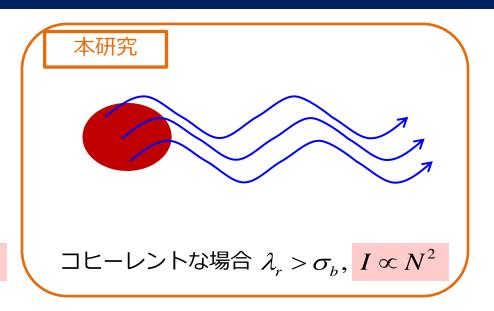
スリットの導入により、短パルス化

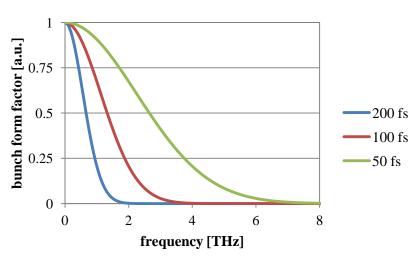
- ✓ 背景 パルスラジオリシス法 超短パルス電子ビーム
- ✓ 超短パルス電子ビーム発生法 レーザーフォトカソードRF電子銃ライナック 磁気パルス圧縮器 短パルス化のための改善点
- ✓ コヒーレント遷移放射によるパルス幅測定法 コヒーレント遷移放射 光学系・測定法の概要
- ✓ 超短パルス電子ビームパルス幅測定結果
- ✓ 結論と展望

コヒーレント放射とバンチ形状因子



インコヒーレントな場合 $\lambda_r < \sigma_b$, $I \propto N$

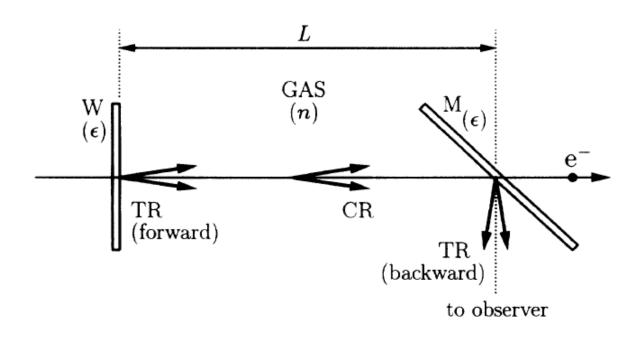




バンチ形状因子

バンチ長が短くなるほど、高周波 までの放射が可能となる。

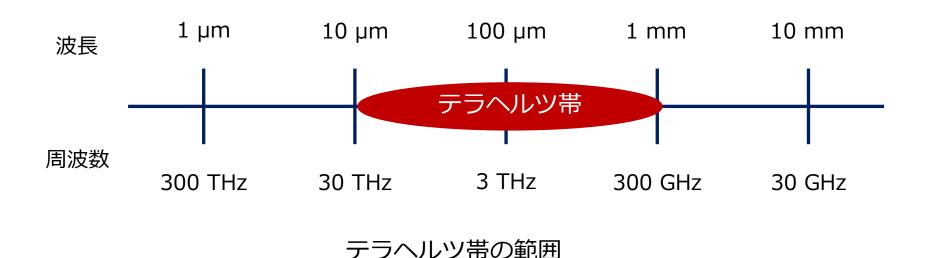
コヒーレント遷移放射 (CTR)



テラヘルツ波の発生 T.Takahashi et al., Phys. Rev. E 50, 4014 (1994).

電子ビームが異なる媒質間の境界面で、その電場により、媒質の分極を引き起こし、それが電磁波として伝播する。

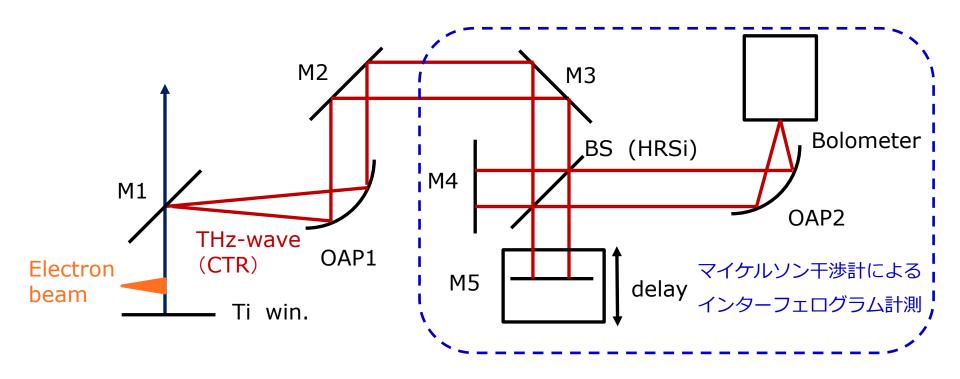
テラヘルツ波



テラヘルツ波の性質

- ●光と電波の境界付近の波長の電磁波
- ●近年、検出器の進歩により、検出可能となった。

光学系



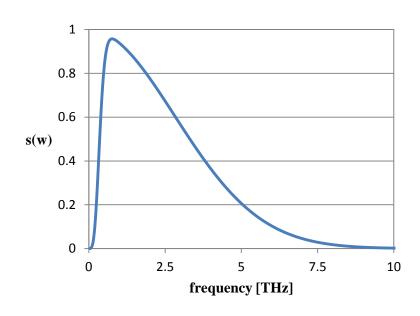
コヒーレント遷移放射測定系

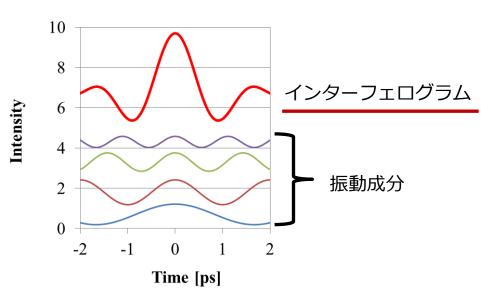
コヒーレント遷移放射によって発生したテラヘルツ波 の自己相関をマイケルソン干渉計で取得する

パルス幅測定の原理

$$S(\omega) = e^{(-(\sigma\omega)^2)} - 2e^{(-(\sigma^2 + \xi^2)\omega^2)} + e^{(-(\sigma^2 + 2\xi^2)\omega^2)}$$

$$s(\tau) \approx \begin{bmatrix} \exp\left\{-\frac{(\tau - \tau_0)^2}{4\sigma^2}\right\} - \frac{2\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \xi^2}} \exp\left\{-\frac{(\tau - \tau_0)^2}{4(\sigma^2 + \xi^2)}\right\} \\ + \frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + 2\xi^2}} \exp\left\{-\frac{(\tau - \tau_0)^2}{4(\sigma^2 + 2\xi^2)}\right\} \end{bmatrix}$$





周波数スペクトル (σ = 40 fs, ξ = 0.5 ps)

インターフェログラム

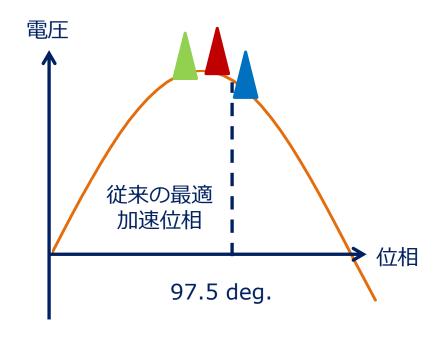
実験的に得たインターフェログラムに解析的な関数をフィッティングすることにより、パルス幅を測定する。

Ref.: A. Murokh et al., Nucl. Instrum. Meth. A 410, 452 (1988).

- ✓ 背景 パルスラジオリシス法 超短パルス電子ビーム
- ✓ 超短パルス電子ビーム発生法 レーザーフォトカソードRF電子銃ライナック 磁気パルス圧縮器 短パルス化のための改善点
- ✓ コヒーレント遷移放射によるパルス幅測定法 コヒーレント遷移放射 光学系・測定法の概要
- ✓ 超短パルス電子ビームパルス幅測定結果
- ✓ 結論と展望

パルス幅の加速管加速位相依存性

- ●フェムト秒RF電子銃
- ●高次収差補正用磁気パルス圧縮器



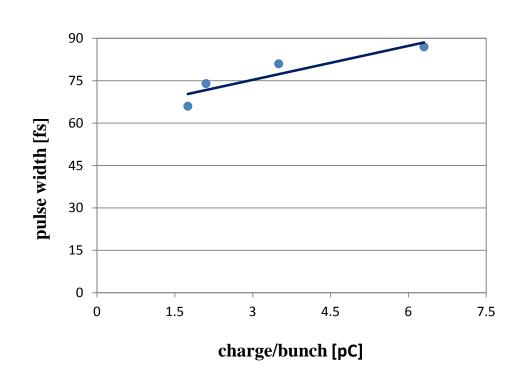
0.6 phase = 85° σ = 410 fs phase = 95° 0.4 $\sigma = 160 \text{ fs}$ Intensity [a.u.] phase = 100° $\sigma = 100 \text{ fs}$ 0.2 -2 Delay [ps]

加速位相

インターフェログラムを用いたパルス幅測定

CTRを用いたパルス幅測定手法を確立したため、 <100 fsの電子ビーム発生に挑戦!

パルス幅の電荷量依存性



✓レーザー出力:15 µJ

✓電荷量:1.75 - 6.3 pC

✓パルス幅: 66 - 87 fs

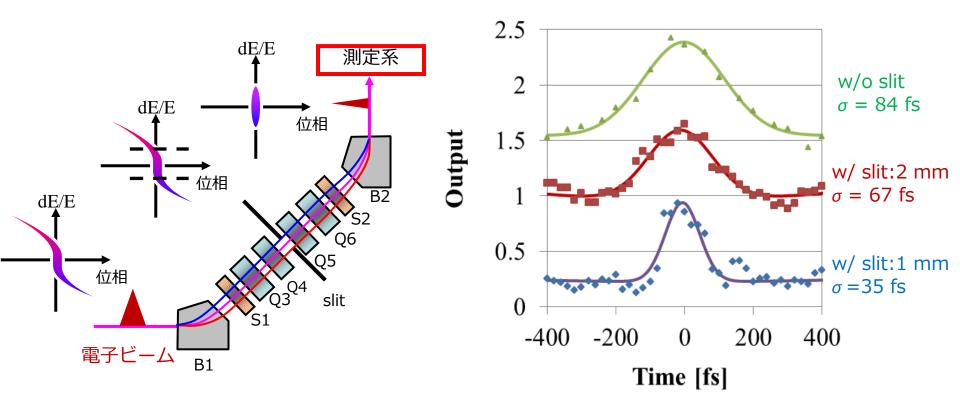
√加速管加速位相: 105 deg.

√w/o slit

パルス幅の電荷量依存性

バンチ当たりの電荷量を減少させるほど、パルス幅が短くなる傾向

スリットの導入によるパルス幅の低減



スリットを導入した磁気パルス圧縮器

スリット幅を変更した際のパルス幅依存性

1 mm幅のスリットを用いてパルス幅を35 fs まで低減(従来: 100 fs)

- ✓ 背景 パルスラジオリシス法 超短パルス電子ビーム
- ✓ 超短パルス電子ビーム発生法 レーザーフォトカソードRF電子銃ライナック 磁気パルス圧縮器 短パルス化のための改善点
- ✓ コヒーレント遷移放射によるパルス幅測定法 コヒーレント遷移放射 光学系・測定法の概要
- ✓ 超短パルス電子ビームパルス幅測定結果
- ✓ 結論と展望

結論と展望

結論

- CTRを用いた、従来よりも高時間分解能の電子 ビームパルス幅測定法を開発した。
- 超短パルス電子ビーム発生系の改善により、35fs の電子ビームを発生した。

展望

- 圧縮条件の最適化により、アト秒電子ビームの発生を行う。
- ・パルス幅測定法を最適化し、より短パルスの電子 ビームのパルス幅測定に適用できるようにする。